

1. Record Nr.	UNINA9910145113403321
Titolo	4th IEEE International Symposium on Electronic Design, Test and Applications (delta 2008) : 23-25 January 2008, Hong Kong, China // IEEE Computer Society
Pubbl/distr/stampa	Piscataway, New Jersey : , : Institute of Electrical and Electronics Engineers, , 2008
ISBN	1-5090-7977-7
Descrizione fisica	1 online resource (84 pages)
Altri autori (Persone)	OsseiranAdam
Disciplina	621.381
Soggetti	Electronics - Design Electronics - Testing
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph